

# 電界放出形走査電子顕微鏡

キーワード: 表面観察、組成

メーカー: 日本電子株式会社

型式: JSM-7800F

測定項目: SEM: 表面観察、EDS: 組成分析

## 主な仕様及び特長:

表面観察では、試料状態に因りますが、倍率25～1,000,000で観察できます。最大30mm径の試料が観察できますが、磁気を帯びた試料、水分や油分を含む試料、真空中でガスが発生する試料は観察できません。非導体試料は、コーティングにより鮮明な画像が得られます。また、エネルギー分散形X線分析装置(EDS)では、スペクトル分析による定性/定量分析、線分析、元素マッピングなどの組成分析が可能です。



設置場所: 第1研究棟1階

担当者: 飯田 聡子

連絡先: 0438-30-4112, iida @ e.kisarazu.ac.jp